

あなた好みの半導体検査を ——

ウェハ外観検査装置

Cosmo Finder

通常の“箱物”とはひと味ちがう オプション性
なのに「良コストパフォーマンス」、なのに「省スペース」

2~12インチウェハ

ベアウェハ

パターン実装済ウェハ

バックラインディング済ウェハ

エキスパンド済ウェハ

割れ欠けウェハ etc...

吸着ユニット追加

透過照明ユニット追加

ローダー追加

特殊画像処理・AI追加

SiC欠陥分類機能

(ヒートマップ作成機能)追加

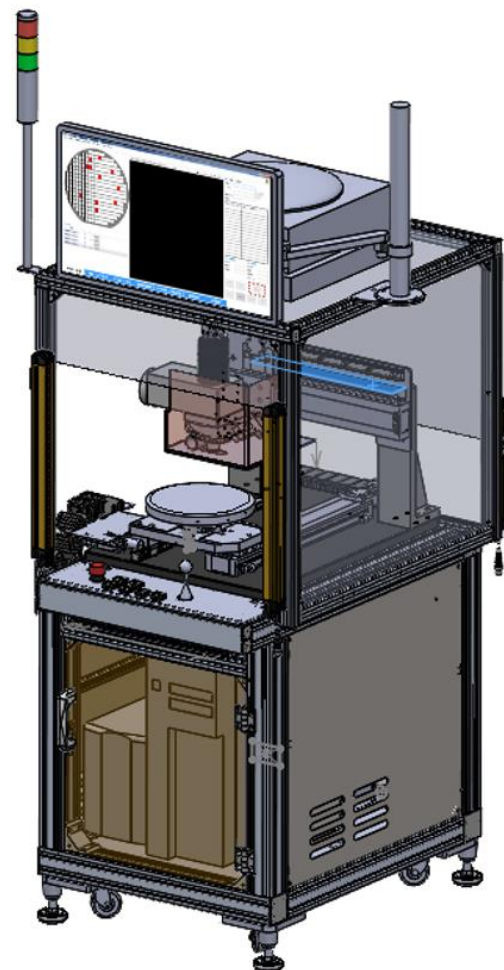
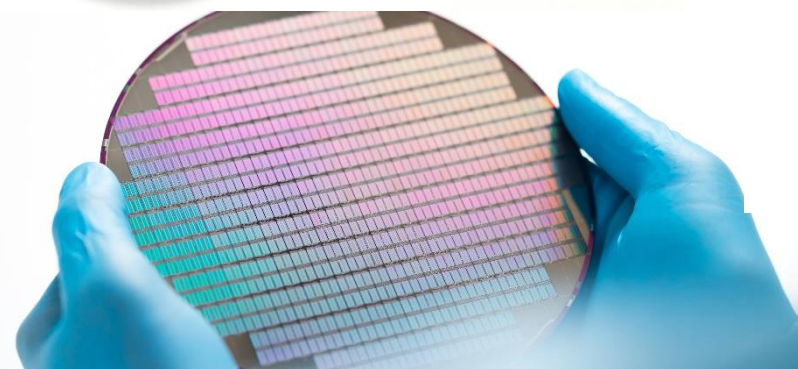
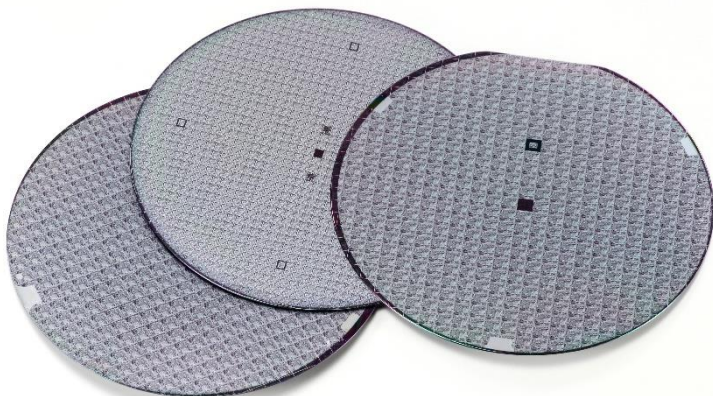
文字認識追加

バーコード対応

出力レポートフォーマット対応

GEMなどの上位システム通信対応

安全対策対応 etc...



40年以上の経験とノウハウが、“不可能”を“可能”に変える。

10,000件以上のお客様の声から培った画像解析技術

画像解析ソフト開発のパイオニアとして、多くのお客様のご要望を取り入れ、様々な欠陥認識が可能。パターンマッチングやAI(オプション)を用いた検出も実現しました。

高速撮影

ノンストップ撮影、追従式オートフォーカス、高速化アルゴリズムにより6インチウエハ全面約5min(対物レンズ5x)を実現。

高い利便性

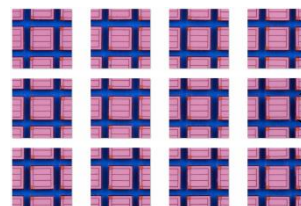
単純な2値化機能のほかに良品比較機能もあり、チップ配列に応じて画像処理内容をレシピ登録可能。また、視野からはみ出るチップの撮影パターン登録機能や、検査後マップからの再レビュー機能等、高い利便性を誇ります。

省スペース設計

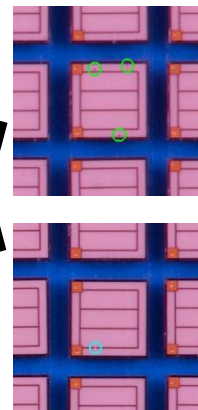
本体内部に光学ユニット、駆動ユニット、画像処理ユニット、制御ユニットをビルトインし、省スペースながらハイパフォーマンスを実現。

製造工程からR&D部門まで、あらゆるシーンで対応可能です。

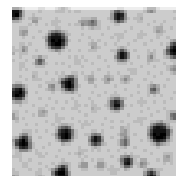
■良品比較例



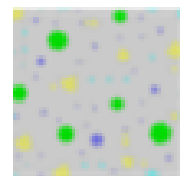
良品画像を登録して・・・
欠陥認識！



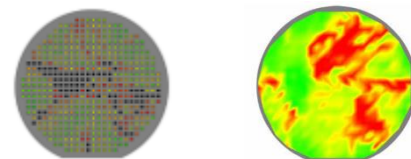
■SiC欠陥分類例(オプション)



種々の方法で・・・
分類！



ヒートマップの作成も可能です



標準スペック

ウェハサイズ	6インチ、8インチ	カメラ	2/3型 500万画素CMOSカメラ
検出方式	顕微鏡画像処理方式 (輝度抽出、高速パターンマッチング)	光源	白色LED
検出時間	約5min/wafer (6インチ、対物レンズ5x) 約15min/wafer (6インチ、対物レンズ10x) 約8min/wafer (8インチ、対物レンズ5x) 約30min/wafer (8インチ、対物レンズ10x)	オートフォーカス	レーザーセンサを用いた事前スキャン 画像オートフォーカス
		装置寸法	W635 H1,737 D1,038 (mm)
		装置重量	約130kg
分解能	1.38μm (対物レンズ5x時) 0.69μm (対物レンズ10x時)	オプション	下部ご参照

オプション例

- ウェハ対応・・・2～12インチウエハ、ベアウエハ、パターン実装済ウエハ、バックグラインディング済ウエハ、エキスパンド済ウエハ、割れ欠けウエハ etc...
- ハードウェア・ソフトウェア対応・・・吸着ユニット追加、透過照明ユニット追加、ローダー追加、特殊画像処理・AI追加、SiC欠陥分類機能(ヒートマップ作成機能)追加、文字認識追加、バーコード対応、出力レポートフォーマット対応、GEMなどの上位システム通信対応、安全対策対応 etc...



MITANI CORPORATION

三谷商事株式会社 ビジュアルシステム部

東京 〒171-0033 東京都豊島区高田3-28-2 FORECAST高田馬場1F TEL:03-5949-6220
大阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24 新大阪第一生命ビル12F TEL:06-6399-3755
名古屋 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-12-13 丸の内プラザビル6F TEL:052-220-0525
福岡 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-6-10 FKBビル8F TEL:092-473-8611
開発 〒910-8510 福井県福井市豊島1-3-1 第3三谷ビル2F TEL:0776-20-3570

<https://mitani-visual.jp>

デモ機、ございます！

ウェハをご用意いただき、

弊社までお気軽にお問合せください！